10F2

Search Notes			

		4 1 -	
	Application/Control No.	Applicant(s)/Patent under Reexamination	
	10/037,755	CHO ET AL.	
ı	Examiner	Art Unit	
	KHAI TRAN	2611	

SEARCHED			
Class	Subclass	Date	Examiner
375	298,146	12/12/2007	кт
455	561,562	12/12/2007	кт
·			
			_

INTERFERENCE SEARCHED				
Class	Subclass	Date	Examiner	
		-		
	-			
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		

SEARCH NOTES (INCLUDING SEARCH STRATEGY)				
		DATE	EXMR	
EAST Search		12/12/2007	КТ	
-				
<u>,                                      </u>				



Application/Control No.	Applicant(s)/Patent under Reexamination
10/037,755	CHO ET AL.
Examiner	Art Unit
Erin M. File	2611

SEARCHED				
Class	Subclass	Date	Examiner	
375	130	11/6/2006	EMF	
375	140	11/6/2006	EMF	
375	141	11/6/2006	EMF	
375	.146	11/6/2006	EMF	
370	208	11/6/2006	EMF	
370	209	11/6/2006	EMF	
370	329	11/6/2006	EMF	
. 370	335	11/6/2006	EMF	
370	341	11/6/2006	EMF	
370	. 342	11/6/2006	EMF	
370	431	11/6/2006	EMF	
370	441	11/6/2006	EMF	
370	491	11/6/2006	EMF .	
370	500	11/6/2006	EMF	

INTERFERENCE SEARCHED			
Class	Subclass	Date	Examiner
			ļ
			y. Ly

SEARCH NOT (INCLUDING SEARCH		)
	DATE	EXMR
EAST US PAT, USPGPUB, EPO, JPO DERWENT, IBM (text search only— see search history printout)	11/6/2006	EMF
PLUS Search	11/6/2006	EMF
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		